

CEI 60749-4
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –**

**Partie 4: Essai continu fortement accéléré
de contrainte de chaleur humide (HAST)**

IEC 60749-4
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

**Part 4: Damp heat, steady state, highly
accelerated stress test (HAST)**

CORRIGENDUM 1

Page 2

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 3

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

[IEC 60749-4:2002/COR1:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3cb56c75-1ee2-4291-a8ec-c86d24544bdf/iec-60749-4-2002-cor1-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/3cb56c75-1ee2-4291-a8ec-c86d24544bdf/iec-60749-4-2002-cor1-2003>